Projekte Laufkarten Module Messungen Benutzer: № 99 "" Gruppen: anzeigen abmelden

Geräte Hilfe Persönlicher Eingang

LAUFKARTE

## IWE-1 Labor für Mikrostrukturintegration

Versuchslaufkarte

Projekt/Name	Chargennummer	Anzahl der Wafer		
AIXsense_1	#1	W × 6		

## Ziel der Charge / Bezug und Änderungen zur vorherigen Charge

Chargen-Begleiter				
Name	Email	Telefon Nummer		
SensUS2018	paula.palacios@rwth-aachen.de			

	Modul 1: Waferauswahl (V3)	Status: Freigegeben
	Nr: 1 Wafer V Nr: 2 Wafer V Nr: 3 Wafer V Nr: 4 Wafer V Nr: 5 Wafer V Nr: 6 Wafer V	
Nr. 1	Wafer auswählen	
	Modul 2: Piranha (V3)	Status: Freigegeben
	Nr: 1 Wafer ✓ Nr: 2 Wafer ✓ Nr: 3 Wafer ✓ Nr: 4 Wafer ✓ Nr: 5 Wafer ✓ Nr: 6 Wafer ✓	
Nr. 2	Piranha ansetzen	
Nr. 3	Piranha-Reinigung	
Nr. 4	Spülen	
	Modul 3: Standard nLOF 2035 2μm (V5)	Status: Freigegeben
	Nr: 1 Wafer ✓ Nr: 2 Wafer ✓ Nr: 3 Wafer ✓ Nr: 4 Wafer ✓ Nr: 5 Wafer ✓ Nr: 6 Wafer ✓	
Nr. 5	Vorbehandlung Plasmastripper	
Nr. 6	HMDS	
Nr. 7	Beschichtung Fotolack	
Nr. 8	Ruhezeit	
Nr. 9	Prebake Fotolack	
Nr. 10	Belichtung Fotolack	
Nr. 11	Post Exposure Bake Fotolack	
Nr. 12	Entwicklung Fotolack	
Nr. 13	Kontrolle Strukturierung Fotolack	
Nr. 14	Messung Fotolackdicke	
	Modul 4: Sputtern flexibel (V2)	Status: Freigegeben
	Nr: 1 Wafer ✓ Nr: 2 Wafer ✓ Nr: 3 Wafer ✓ Nr: 4 Wafer ✓ Nr: 5 Wafer ✓ Nr: 6 Wafer ✓	
Nr. 15	Einbau in die Sputteranlage	
Nr. 16	Sputtern	
Nr. 17	Sputtern 2	
Nr. 18	Ausbau / Kontrolle	
	Modul 5: Lift-Off nLOF (V6)	Status: Freigegeben
	Nr: 1 Wafer ✓ Nr: 2 Wafer ✓ Nr: 3 Wafer ✓ Nr: 4 Wafer ✓ Nr: 5 Wafer ✓ Nr: 6 Wafer ✓	
Nr. 19	Lift-Off DMSO	
Nr. 20	Kontrolle	

	Maded Co Vanhahan and una consiste at (VA)	to a Fig. 1
		atus: Freigegeben
	Nr: 1 Wafer ✓ Nr: 2 Wafer ✓ Nr: 3 Wafer ✓ Nr: 4 Wafer ✓ Nr: 5 Wafer ✓ Nr: 6 Wafer ✓	
Nr. 21	Plasmareinigung	
Nr. 22	Hotplate	
	Modul 7: SU8-100 75μm (V1)	Status: Benutzt
	Nr: 1 Wafer ✓ Nr: 2 Wafer ✓ Nr: 3 Wafer ✓ Nr: 4 Wafer ✓ Nr: 5 Wafer ✓ Nr: 6 Wafer ✓	
Nr. 23	Belacken	
Nr. 24	Wartezeit Fotolack	
Nr. 25	Softbake	
Nr. 26	Belichten	
Nr. 27	Post Exposure Bake	
Nr. 28	Entwickeln	
Nr. 29	Kontrolle Entwicklung, Dickenmessung	
	Modul 8: Standard Sägeschutzlack (V1)	atus: Freigegeben
	Nr: 1 Wafer ✓ Nr: 2 Wafer ✓ Nr: 3 Wafer ✓ Nr: 4 Wafer ✓ Nr: 5 Wafer ✓ Nr: 6 Wafer ✓	
Nr. 30	Beschichtung Fotolack AZ9260	
Nr. 31	Hardbake Fotolack AZ9260	
	Modul 9: Sägen (V4)	atus: Freigegeben
	Nr: 1 Wafer V Nr: 2 Wafer V Nr: 3 Wafer V Nr: 4 Wafer V Nr: 5 Wafer V Nr: 6 Wafer V	
Nr. 32	Sägen	

N	lodul 1: Wafe	rauswahl (V3	3)				Sta	tus: Freig	egeben
		,	Nr: 3 Wafer ✓	Nr: 4 Wafer √	Nr: 5 Wafer ✓	Nr: 6 W			
Nir	Wafer auswä			1		1			
W1									
W2									
W3									
W4									
W5									
W6									
	Wafertyp: Glaswafer								
	Bemerkung:								
	Bearbeiter:					Datum:			
N	<b>/lodul 2:</b> Pirar	nha (V3)					Sta	tus: Freig	egeben
Nr:	1 Wafer ✓ N	Nr: 2 Wafer ✓	Nr: 3 Wafer ✓	Nr: 4 Wafer ✓	Nr: 5 Wafer ✓	Nr: 6 W	/afer ✓		
Nr. 2	Piranha anse	tzen							
	Vorsicht: Aus auftreten. Lös zu explosions tragen. Arbeit	sgangsstoffe sung kann sic sartiger Gase ten nur unter	Schwefelsäure:W und Lösung sind th bis auf 120°C a ntwicklung komm dem Abzug. xid, Konz. 30%	stark ätzend, Caufheizen. Subs	Gasentwicklung b strate müssen fre	ei von Lö	sungsmi	tteln sein, d	la es sonst
	Chargennum	mer:		Minde	esthaltbarkeitsda	tum:			
	Material: Sch	nwefelsäure, l	Konz. 96%						
	Chargennum	mer:		Minde	esthaltbarkeitsda	tum:			
W1									
W2									
W3									
W4									
W5									
W6									
	Ansatzvolun Gefäß: Glasg	,	für Einzelwafer) rgröße						
	Bemerkung	I							
	Bearbeiter:					Datum:			

Nr. 3	Piranha-Rein	gung			
W1					
W2					
W3					
W4					
W5					
W6					
	Bitte beachte Verweildaue	en: - -Reinigung: 30 min			
	Bemerkung:				
	Bearbeiter:		Datum:		
Nr. 4	Spülen				
W1					
W2					
W3					
W4					
W5					
W6					
	-	Wafer in viel Wasser legen und ständig mit frischem Wasser	spülen.		
	Trocknen: m	t N2-Pistole			
	Bemerkung:				
	Bearbeiter:		Datum:		
M	edul 2. Ctopo	ord at OF 2025 2um (VE)		Outres Froign	agaban
		ard nLOF 2035 2μm (V5)		Status: Freig	egeben
_	1 Water ✓   N	Ir: 2 Wafer ✓   Nr: 3 Wafer ✓   Nr: 4 Wafer ✓   Nr: 5 Wafer ✓	Nr: 6 W	/afer √	
Nr. 5	Vorbehandlur	g Plasmastripper			
	Wafern; 3min	Vafer stehend, Flat nach oben, Strukturseite zeigt zum Griff, g 300W; 200sccm O2 mit PI bzw. 300sccm O2 ohne PI	gleichmäſ	Siger Abstand zwisch	nen den
	Gerät: Plasm	astripper			
W1					
W2					
W3					
W4					
W5 W6					
VVO					I
	Bemerkung				
	Bearbeiter:		Datum:		

Nr. 6	HMDS						
	Parameter: 15m	 nin @ 12∩°C					
	Anwendung: Haftvermittler für Fotolacke auf Silzium/-oxid/-nitrid und auf Glas						
	Gerät: HMDS-O		701 O.L.	III OMG/ Hitra and ad.	Olao		
W1		1011					
W2							
W3							
W4							
W5							
W6							
• •	Bemerkung:						
	Bearbeiter: Datum:						
	Deal Deiter.			!	Datum	· <b>_</b>	
Nr. 7	Beschichtung Fotolack						
	Solldicke: 2µm						
		schlossen mit Gyrset; 2800l	U/min @	30s; ACCN 1000U/min	n/s;		
	Gerät: Lackschle						
	Material: nLOF	2035					<u>.</u>
	Chargennumme	∍r:		Mindesthaltbarkeitsda	atum:		
W1							
W2							
W3							
W4							
W5							_
W6	<u> </u>						
	Bemerkung:						
	Bearbeiter:				Datum:		
Nr. 8	Ruhezeit						
	Parameter: Waf	fer nach Belackung 10min	@ RT lie	gen lassen			
W1							
W2							
W3							
W4							
W5							
W6							
	Bemerkung:						
	Bearbeiter:				Datum:		

Nr. 9	Prebake Fotolack		
	Parameter: 60s @ 110°C		
	Gerät: Hotplate Semitec		
W1			
W2			
W3			
W4			
W5			
W6		-	
	Bemerkung:		
	Bearbeiter:	Datum:	
Nr. 10	Belichtung Fotolack		
	Lampenleistung:		
	Parameter: Hartkontakt;		
	Belichtungszeit:		
	Lampenleistung:		
	Gerät: Karl Süss Mask Aligner MA6		
W1			
W2			
W3			
W4			
W5			
W6			
	Belichtungsdosis: 36mJ/cm2		
	Justage: Flatjustage		
	Maske: SUS-MS1-1		
	Blaue Folie kleben!		
	Bemerkung:		
	Bearbeiter:	Datum:	

Nr. 11	Post Exposur	Post Exposure Bake Fotolack					
	Parameter: 6	Parameter: 60s @ 110°C					
	Gerät: Hotpla	ate Se	emitec				
W1							
W2							
W3							
W4							
W5							
W6							
	Bemerkung:						
	Bearbeiter:				Datum:		
Nr. 12	Entwicklung F	-otola	ack				
	Parameter: Rüttelgeschwindigkeit 300 U/min; für jeden Wafer frischen Entwickler verwenden (120 ml/Wafer); Wafer mit DI-Wasser abspülen und in fließendes DI-Wasser stellen; anschließend in Trockenschleuder (Prog. 3) oder mit N2 Pistole trocknen  Geräte: Rüttelgerät,Nasschemiebank Kissler,runde PP-Dose  Material: Unverdünnte Entwicklerlösung AZ726 MIF						
	Chargennum	mer:		Mindesthaltbarkeitsda	atum:		
W1							
W2							
W3							
W4							
W5							
W6							
	Entwicklung	szeit:	: 60s				
	Bemerkung:						
	Bearbeiter:				Datum:		

7 von 16

Nr. 13	Kontrolle Stru	cturierung Fotolack		
	Paramter: Ob	jektiv Nr.3 (10x) und Nr.5 (50x); Hellfeld		
		rien: Alle Strukturöffnungen sind frei		
	Gerät: Stereo	mikroskop Leitz Ergolux AMC (Litho)		
W1				
W2				
W3				
W4				
W5				
W6				
	Bemerkung:			
	Bearbeiter:	Date	um:	
Nr. 14	Messung Foto	ackdicke		
	Paramter: Pro Gerät: Profilor	gramm LACKTEST		
W1	Soluti i folilo	Total		
W2				
W3				
W4				
W5				
W6				
	Messung: (Ve	rsion: )		
	Bemerkung:			
	Deembeiten.			<u> </u> 
	Bearbeiter:	Date	um:   	
		rn flexibel (V2)	Status: Freig	egeben
Nr:	1 Wafer ✓ N	r: 2 Wafer ✔  Nr: 3 Wafer ✔  Nr: 4 Wafer ✔  Nr: 5 Wafer ✔  Nr	: 6 Wafer ✓	
Nr. 15	Einbau in die	Sputteranlage		
	Gerät: Nordik	NS2550 Berlin		
W1				
W2				
W3				
W4				
W5				
W6				
	Bemerkung:			
	Bearbeiter:	Date	um:	

Nr. 16	Sputtern		
W1			
W2			
W3			
W4			
W5			
W6			
	Dicke [nm]: 30 Metall: Ti		
	Bemerkung:		
	Bearbeiter:	Datum:	
Nr. 17	Sputtern 2		
W1			
W2			
W3			
W4			
W5			
W6			
	Dicke [nm]: 270 Metall: Au		
	Bemerkung:		
	Bearbeiter:	Datum:	
Nr. 18	Ausbau / Kontrolle		
	Qualitätskriterium: 1.) ganzflächige Metallabscheidung 2.) keine Ablöse Gerät: Kontrolle mit bloßem Auge	ung des Metalls	
W1			
W2			
W3			
W4			
W5			
W6			
	Bemerkung:		
	Bearbeiter:	Datum:	
	<b>lodul 5:</b> Lift-Off nLOF (V6)		ıs: Freigegeben
NI.	1 Wofor V Nr. 2 Wofor V Nr. 2 Wofor V Nr. 4 Wofor V Nr. 5 Wofor	A N. O.W. Const	

Nr: 1 Wafer ✓ Nr: 2 Wafer ✓ Nr: 3 Wafer ✓ Nr: 4 Wafer ✓ Nr: 5 Wafer ✓ Nr: 6 Wafer ✓

Nr. 19	Lift-Off DMSO						
	Achtung!: Wafer in diesem Schritt nicht ins Ultraschallbad stellen!  Parameter: Jeden Wafer mit der Strukturseite nach unten in eigene PP-Dose mit sauberem 80°C heißem DMSO legen (125ml / Wafer, Abstandshalter verwenden)  Verschlossene PP-Dosen 24h @ 80°C im Umluftofen lagern; Wafer nacheinander aus dem Umluftofen nehmen, mit sauberem DMSO aus der Spritzflasche abspülen und mit der Strukturseite nach unten in PP-Dose mit sauberem DMSO legen (Abstandshalter verwenden)  Wafer 5min in fließendes DI-Wasser stellen; im Umluftofen bei 75°C trocken  Gerät: runde PP-Dosen  Material: DMSO						
	Chargennumme	Chargennummer: Mindesthaltbarkeitsdatum:					
W1 W2							
W3							
W4							
W5							
W6							
	Bemerkung:						
	Bearbeiter:			Datum:			
Nr. 20	Kontrolle						
	Qualitätskriteri Gerät: Lichtmikr	um: Photolack ist vollständig entfer roskop Litho	nt; alle Metallstrukturer	sind vorhand	den; keine Ablösı	ungen	
W1							
W2							
W3 W4							
W5							
W6							
				Datum:			

Nr: 1 Wafer ✓ Nr: 2 Wafer ✓ Nr: 3 Wafer ✓ Nr: 4 Wafer ✓ Nr: 5 Wafer ✓ Nr: 6 Wafer ✓

Nr. 21					
	Parameter: Wafer stehend, Flat nach oben, Strukturseite zeigt zum Griff, gleichmäßiger Absta Wafern; Gerät: Plasmastripper	and zwischen den			
W1					
W2					
W3					
W4					
W5					
W6					
	Leistung: 300 W O2-Fluss: 200 sccm (belackter Wafer) oder 300 sccm (unbehandelter Wafer) Zeit: 3 min				
	Bemerkung:				
	Bearbeiter: Datum:				
Nr.					
22					
W1	1				
W1 W2	1 2 2				
W1 W2 W3	1 2 3 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6				
W1 W2 W3 W4	1				
W1 W2 W3 W4 W5	1				
W1 W2 W3 W4	1				
W1 W2 W3 W4 W5	1				
W1 W2 W3 W4 W5	1				
W1 W2 W3 W4 W5	1				
W1 W2 W3 W4 W5	1				
W1 W2 W3 W4 W5	1				
W1 W2 W3 W4 W5 W6	1 2 3 4 5 6 Dauer [min]: 10 Hotplate: Temperatur [°C]: 120 Bemerkung:	Status: Benutzt			

Nr. 23	Belacken				
	Gerät: RC 8 mit G Lackmenge: 4g S Zieldicke: 75µm SchleuderParame 500 upm; 500upm 4000 upm; 1000 u Material: SU 8 10	eter: u/s; 5s; upm/s; 30s			
	Chargennummer:		Mindesthaltbarkeitsdatum:		
W1					
W2					
W3					
W4					
W5					
W6					
	Bemerkung:				
	Bearbeiter:		Datu	m:	
Nr. 24	Wartezeit Fotolack	(			
	Parameter: 10 mi	n @ RT			
W1					
W2					
W3					
W4					
W5					
W6	Bemerkung:				
	Bearbeiter:		Datu	m:	

Nr. 25	Softbake		
	Temperaturverlauf/Softbake:		
	in 10 min auf 65°C, 20 min halten		
	in 15 min auf 95°C, 20 min halten		
	in 30 min auf 65°C, 20 min halten		
	in 60 min auf 25°C, 30 min halten		
	Gerät: Hotplate		
W1			
W2			
W3			
W4			
W5			
W6			
	Bemerkung:		
	<u> </u>		<u> </u>
	Bearbeiter:	Datum:	
	'	l I	
_			
Nr. 26	Belichten		
	Belichten  Belichtungsdosis::: 300mJ/cm²		
	Belichtungsdosis::: 300mJ/cm²		
26 W1	Belichtungsdosis::: 300mJ/cm² Gerät: Karl Süss Mask Aligner MA6		
26 W1 W2	Belichtungsdosis::: 300mJ/cm² Gerät: Karl Süss Mask Aligner MA6		
W1 W2 W3	Belichtungsdosis::: 300mJ/cm² Gerät: Karl Süss Mask Aligner MA6		
W1 W2 W3 W4	Belichtungsdosis::: 300mJ/cm² Gerät: Karl Süss Mask Aligner MA6		
W1 W2 W3 W4 W5	Belichtungsdosis::: 300mJ/cm² Gerät: Karl Süss Mask Aligner MA6		
W1 W2 W3 W4	Belichtungsdosis::: 300mJ/cm² Gerät: Karl Süss Mask Aligner MA6		
W1 W2 W3 W4 W5	Belichtungsdosis::: 300mJ/cm² Gerät: Karl Süss Mask Aligner MA6		
W1 W2 W3 W4 W5	Belichtungsdosis::: 300mJ/cm² Gerät: Karl Süss Mask Aligner MA6		
W1 W2 W3 W4 W5	Belichtungsdosis::: 300mJ/cm² Gerät: Karl Süss Mask Aligner MA6  Maske: SUS-MS1-2		
W1 W2 W3 W4 W5	Belichtungsdosis::: 300mJ/cm² Gerät: Karl Süss Mask Aligner MA6  Maske: SUS-MS1-2  Mit i-Linienfilter belichten!!!		

Nr. 27	Post Exposur	re Bak	e				
	Gerät: Hotpla	ate					
	Temperaturverlauf/PEB:						
			90 min halten				
			30 min halten				
W1							
W2							
W3							
W4							
W5							
W6							
	Bemerkung	:					
	Bearbeiter:				Datum:		
Nr. 28	Entwickeln						
			mit mr-Dev 600. Dann spülen m				oropanol.
	Gründlich mit Wasser spülen und zum Schluß in der nicht verschlossenen Waferdose trocknen lassen. Entwicklungszeit:: 30 min.						
	Material: mr-Dev 600						
		I		Mindesthaltbarkeitsda	otum:		Ī
	Chargennum	iiiiei.		IMITIGESTIAIDAIKEITSU	atuiii.		
W1							
W2							
W3							
W4							
W5	,						
W6							
	Bemerkung	:					
	Bearbeiter:				Datum:		•

Nr.				1
29	Kontrolle Entwicklung, Dickenmess	sung		
	Beschreibung: Prüfen ob Defekte	e wie Risse, Blasen oder Ablösungen v	orliegen; Dickenme	ssung
	Dicke in Dokument X:∖Datenaustau	usch IWE1\Technologie\02.12.2011_Sl	J8-Dickenparamete	er eintragen.
	Parameter: Lichtmikroskop Leitz,	50x Objektiv, Hellfeld; Tencor		
W1				
W2				
W3				
W4				
W5				
W6				
	Bemerkung:			
	Bearbeiter:		Datum:	
М	odul 8: Standard Sägeschutzlack (	(V1)	Stat	us: Freigegeben
Nr:	1 Wafer ✓ Nr: 2 Wafer ✓ Nr: 3 \	Wafer ✓ Nr: 4 Wafer ✓ Nr: 5 Wafer	✓ Nr: 6 Wafer ✓	
Nr. 30	Reschichtung Estolack A70260			
	Parameter: Programm Nr. 5, goes	hlossen mit Gyrset, 60s@1200U/min,	ACCN 500(LI/min)/	
	rarameter. Frogramm Nr. 3, gest	illosseit tillt Gyrset, 605@12000/tillit, /	ACCIN 500(C/IIIII)/.	5
	Zeitbindung beachten!: Ausführu	•	7.00N 300(0/11111)/.	5
		ing innerhalb von 24h!	7.0014 300(0/11111)/	5
	Zeitbindung beachten!: Ausführu	ing innerhalb von 24h!	7.CO14 300(O/IIIII)/	5
	Zeitbindung beachten!: Ausführu Soll-Ergebnis: Gesamtdicke 8mü	ing innerhalb von 24h!		
	Zeitbindung beachten!: Ausführu Soll-Ergebnis: Gesamtdicke 8mü Gerät: Lackschleuder RC 8	ing innerhalb von 24h!	1	
	Zeitbindung beachten!: Ausführu Soll-Ergebnis: Gesamtdicke 8mü Gerät: Lackschleuder RC 8 Material: AZ9260 Chargennummer:	ing innerhalb von 24h! +- 1,5mü	1	
	Zeitbindung beachten!: Ausführu Soll-Ergebnis: Gesamtdicke 8mü Gerät: Lackschleuder RC 8 Material: AZ9260 Chargennummer:	ing innerhalb von 24h! +- 1,5mü	1	
W1	Zeitbindung beachten!: Ausführu Soll-Ergebnis: Gesamtdicke 8mü Gerät: Lackschleuder RC 8 Material: AZ9260 Chargennummer:	ing innerhalb von 24h! +- 1,5mü	1	
W1 W2	Zeitbindung beachten!: Ausführu Soll-Ergebnis: Gesamtdicke 8mü Gerät: Lackschleuder RC 8 Material: AZ9260 Chargennummer:	ing innerhalb von 24h! +- 1,5mü	1	
W1 W2 W3 W4	Zeitbindung beachten!: Ausführu Soll-Ergebnis: Gesamtdicke 8mü Gerät: Lackschleuder RC 8 Material: AZ9260 Chargennummer:	ing innerhalb von 24h! +- 1,5mü	1	
W1 W2 W3 W4 W5	Zeitbindung beachten!: Ausführu Soll-Ergebnis: Gesamtdicke 8mü Gerät: Lackschleuder RC 8 Material: AZ9260 Chargennummer:	ing innerhalb von 24h! +- 1,5mü	1	
W1 W2 W3 W4	Zeitbindung beachten!: Ausführu Soll-Ergebnis: Gesamtdicke 8mü Gerät: Lackschleuder RC 8 Material: AZ9260 Chargennummer:	ing innerhalb von 24h! +- 1,5mü	1	

Nr. 31	Hardbake Fotolack AZ9260			
	Gerät: Hotplate			
W1				
W2				
W3				
W4				
W5				
W6				
	Temperatur: 110 °C Zeit: 5 min			
	Bemerkung:			
	Bearbeiter: Datum:			
N	lodul 9: Sägen (V4)  Status: Freigegeben			
	1 Wafer ✓ Nr: 2 Wafer ✓ Nr: 3 Wafer ✓ Nr: 4 Wafer ✓ Nr: 5 Wafer ✓ Nr: 6 Wafer ✓			
Nr. 32	Sägen			
	Material: Sägefolie			
	Gerät: Wafersäge ESEC 8002			
	Generell: Wafer auf Sägefolie aufspannen. Mit Rolle fest rollen. Darauf achten, dass keine Luftblasen			
	eingeschlossen sind.			
	Wafer mit Hilfe der Sägekreuze ausrichten.			
	Index1 und Index2 der Wafergröße sowie ggf. Cutting Depth anpassen. Nach dem Sägen Chips vorsichtig mit Heißluftfön von Folie lösen oder in Aceton legen.			
W1	reach dem eagen emps versioning mit riensiannen verri eine lesem eaer in 7 teeter legen.			
W2				
W3				
W4				
W5				
W6				
	Chipgröße:			
	Hinweis:			
	Schnitttiefe: 70			
	Spindlespeed: 40000 U/min			
	Vorschub: Si = 20mm/s bzw. Glas = 4mm/s			
	Wafermaterial: Si (Sägeblatt FTB R46 40100) bzw. Glas (Sägeblatt Minitron 2.187-10-45H)			
	Bemerkung:			
	Bearbeiter: Datum:			